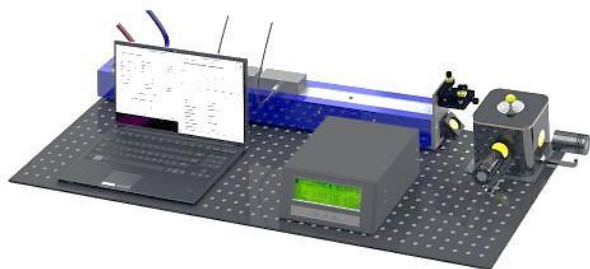


レーザー熱量測定システム



Wavelength 社が新たに開発したレーザー熱量測定システムは、オプティクス製造における費用対効果の高いソリューションを提供する測定装置です。
この装置は、反射ミラーや透過ウインドウ等の相対的に薄いサンプル(2~9mm)のトータル吸収係数(表面および容積)を決定します。吸収測定技術に基づく10.6 μ mでのレーザーオプティクスのコーティング特性を評価する初めての測定装置です。

仕様(型名:LVCM-001)

ワークステーション	レーザー	出力	10W	
		波長	10.6 μ m	
		出力安定性	<3%	
		冷却	水冷	
		アライメント光	可視光	
	温度測定	分解能	<0.1度	
		サンプル	<ul style="list-style-type: none"> ・EFL: 5 インチ焦点距離、平および凸、1.5 インチ径 ・EFL: 7.5 インチ焦点距離、平/凸、1.5 インチ径 ・透過ウインドウ吸収率~0.25%、1 インチ径、3mm 厚み ・反射ミラー吸収率~0.25%、1 インチ径、3mm 厚み 	
	電気系統	電源	240V (13A フューズ)	
	動作条件	振動制御	最低 VC-B(3 μ m)	
		湿度	<50%	
温度		24 \pm 1度		
物理的仕様	エンクロージャー	アルマイト		
	専有面積	2m(L) \times 1m(W) \times 0.5m(H)		
	重量	<70Kg		
ターコンピュータ	モニター	>17 インチ LCD		
	RAM	4GB		
	ハードディスク	>100GB		
	PCI スロット	最低2		
ソフトウェア	OS	Windows XP または Windows 7		
	GUI	温度を度で表示		
		データを時間領域で表示		
		吸収係数を%で表示		
		ON/OFF のコントロールボタンでデータ集積を表示		
		データ・セーブ・ボタンでファイル名入力およびフォーマット		
	データ集積	温度のデータ集積の機能で 集積速度>1ポイント/秒、熱センサーの感度による		
	データ処理	吸収係数計算用のデータ処理		
テキスト・フォーマットでセーブ・データ				
据付ファイル	CD-ROM			